УДК 534-16; 538.951

Посвящается памяти К.С. Александрова

НИЗКОЧАСТОТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В КРИСТАЛЛАХ СоО

© 2011 г. С. А. Гриднев

Воронежский государственный технический университет E-mail: s_gridnev@mail.ru Поступила в редакцию 19.07.2010 г.

В диапазоне температур от -180 до 20° С на частотах порядка нескольких Герц изучено внутреннее трение Q^{-1} в кристаллах СоО, номинально чистых и с добавками Li. Легирование кристаллов СоО примесями Li приводит к появлению на температурной зависимости нового релаксационного максимума Q^{-1} при -115° С на частоте 3 Гц. Возникновение этого максимума связывается с переориентацией упругого диполя Со³⁺–Li¹⁺ под действием внешних механических напряжений.

введение

Окислы переходных металлов (в том числе и СоО) привлекают внимание исследователей в связи с возможностью их использования в качестве модельных кристаллов для теоретических исследований [1], а также из-за наметившихся в последние годы практических применений в качестве высокотемпературных термоэлектрических материалов [2, 3]. Наибольший интерес представляют антиферромагнитные окислы переходных металлов, легированные различными примесями, существенно изменяющими их свойства. Введение примеси (точечного дефекта) в кристалл создает локальные упругие искажения, в результате которых дефект взаимодействует с механическим напряжением, приложенным к кристаллу. Поэтому при изучении дефектов и их влияния на основные физические свойства часто используют метод внутреннего трения, который обладает высокой структурной чувствительностью и информативностью [4, 5]. Однако систематического изучения внутреннего трения Q^{-1} в антиферромагнитных окислах подгруппы железа не проводилось, а в некоторых работах, посвященных этому вопросу, механические потери изучались только в килогерцевом диапазоне частот и в узком интервале температур в окрестности точки Нееля.

Целью данной работы являлось изучение влияния добавок Li на низкочастотное внутреннее трение Q^{-1} и модуль сдвига G в кристаллах CoO, выращенных методом электродугового переноса и полученных по керамической технологии.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАЗЦЫ

Поликристаллические образцы СоО получали по обычной керамической технологии путем спекания тщательно перемешанного порошка квалификации "ч.д.а." в воздушной среде. Монокристаллы СоО были выращены в электрической дуге постоянного тока на специально сконструированной установке. В качестве дуговых электродов использовались керамические стержни из оксида кобальта, которые предварительно отжигались в восстановительной атмосфере водорода при 400°С в течение 0.5 ч для получения электропроводности, достаточной для зажигания дуги. Рост кристалла происходит в результате сублимации вещества катода (температура горения дуги ~5000 К), дальнейшего его транспорта и кристаллизации на аноде со скоростью 5-6 мм/ч. Для предотвращения растрескивания выращиваемых кристаллов ростовой объем окружен платиновым экраном. Выращенные кристаллические були диаметром 8-10 мм и длиной 30-40 мм подвергали отжигу при 1400° С в течение 6-8 ч для снятия термических напряжений. Плотность дислокаций в хорошо отожженных кристаллах, выявленная методом избирательного травления, составляла величину ~10⁵ см⁻². Согласно данным спектрального анализа, концентрация примесей Ті, Ni, Si и Mg в образцах CoO не превышала 10^{-2} мас. %.

Внутреннее трение Q^{-1} и модуль сдвига *G* кристалла измеряли методом обращенного крутильного маятника [6] при амплитуде деформации образца 10^{-5} в диапазоне температур от -180 до 20° С. Величины Q^{-1} и *G* оценивали по измеренным в эксперименте значениям декремента затухания и резонансной частоты маятниковой си-



Рис. 1. Температурные зависимости $Q^{-1}(1, 2)$ и G (3, 4) для поликристаллических образцов СоО без добавок (1, 3) и с добавкой 0.1 мас. % Li (2, 4). Частота 3 Гц.

стемы с погрешностями 10 и 5% соответственно. Образцы для исследований Q^{-1} и G имели вид прямоугольных брусков размером $2 \times 2 \times 30$ мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На температурной зависимости Q^{-1} , измеренной для номинально чистого поликристаллического СоО на частоте ~3 Гц, наблюдаются два пика, обозначенные буквами А и С при температурах -164 и -20° С соответственно (рис. 1, кривая *1*). Температурная зависимость G в области пика А обнаруживает резкий рост с повышением температуры (кривая 3), что связано со структурным фазовым переходом, а в области пика С имеет характерный для релаксационных процессов вид уступа. Введение в керамику добавки 0.1 мас. % Li приводит к появлению при -115°C еще одного пика внутреннего трения, обозначенного на рисунке буквой B (кривая 2), чему соответствует ступенчатое изменение модуля сдвига G (кривая 4). Таким образом, температурный спектр механических потерь в легированном СоО имеет сложный вид. Не обсуждая природу пиков А и С, остановимся на вопросах, связанных с возможными физическими процессами, ответственными за пик *B*.

Прежде всего отметим, что возникновение пика *B* связано с введением в кристалл CoO добавки Li, так как в кристаллах без добавок такая аномалия Q^{-1} отсутствует. Пик *B* является релаксационным, об этом свидетельствует его смещение в сторону более высоких температур при увеличении частоты. Энергия активации релаксационного процесса, определенная по температурному смещению пика Q^{-1} при изменении частоты, составила 0.3 ± 0.1 эB, а предэкспоненциальный мно-



Рис. 2. Температурные зависимости Q^{-1} в СоО при разном содержании добавки Li, мас. % (а): 1 - 0; 2 - 0.1; 3 - 0.5; 4 - 1.0; 5 - 3.0.Частота 3 Гц. На врезке (б): Зависимость высоты пика Q_m^{-1} от концентрации (1) и квадрата концентрации (2) добавки Li.

житель в уравнении Аррениуса $\tau_0 = 10^{-12}$ с. Высота Q_m^{-1} пика *B* растет при увеличении концентрации добавки Li до 3 мас. %, одновременно пик Q^{-1} смещается вниз по шкале температур (рис. 2а).

В поликристаллических образцах твердых растворов механические потери можно рассматривать на основе модели Вагнера, согласно которой потери обусловлены перестройкой межзеренной структуры, возникшей в процессе спекания керамических образцов. Однако в наших экспериментах пик *В* присутствует на температурной зависимости Q^{-1} , снятой не только для керамических образцов, но и для монокристаллов СоО с добавкой 0.1 мас. % Li. При этом энергия активации и τ_0 имеют те же значения, что были получены для керамических образцов. Этот факт свидетельствует о том, что релаксационный процесс, ответственный за пик *B*, не связан с зернограничной релаксацией.

По-видимому, природа обсуждаемого пика B не является дислокационной, поскольку изменение плотности дислокаций почти на два порядка путем предварительного пластического деформирования кристалла практически не повлияла на высоту максимума Q^{-1} (рис. 3).

Пик внутреннего трения в кристаллах CoO: Li (пик *B*) не изменяется в результате воздействия на кристалл статического механического напряжения величиной до 5×10^6 H/m², что делает маловероятным доменный механизм потерь, так как за-



Рис. 3. Температурные зависимости Q^{-1} в окрестности пика *В* для монокристалла CoO + 0.1 мас. % Li при разной плотности дислокаций: $1 - 5 \times 10^5$; $2 - 5 \times 10^6$; $3 - 5 \times 10^7$ см⁻². Частота 3 Гц.

метная перестройка доменной структуры происходит уже при напряжении 10^5 H/m² [7].

Рентгеновский анализ образцов твердого раствора $\text{Li}_x \text{Co}_{1-x} O$ показал, что растворимость Li сохраняется вплоть до x = 0.2, т.е. исследованные в работе образцы были однофазными, и особенности обнаруженной механической релаксации нельзя объяснить явлениями, происходящими в другой фазе.

Проанализируем возможные виды неупругой релаксации, обусловленной точечными дефектами, которые могут возникнуть в кристаллической решетке CoO при добавлении в нее инородного атома. В качестве таких дефектов могут выступать атомы внедрения, атомы замещения и вакансии, поэтому надо выяснить, какой тип дефектов создают атомы Li, введенные в решетку CoO.

Окись кобальта имеет кристаллическую решетку со структурой типа NaCl и плотноупакованной кислородной подрешеткой (a = 4.26 Å). Все октаэдры в решетке заняты ионами Со²⁺. Стехиометрическую СоО получить весьма сложно. Обычно она содержит определенный избыток кислорода вследствие фактического недостатка металла. В связи с необходимостью сохранения электрической нейтральности кристалла это приводит к появлению в решетке СоО ионов Со³⁺ с избыточным положительным зарядом. Оценка, сделанная в [8] с учетом потенциалов ионизации Со, сродства кислорода к электрону и потенциала Маделунга, показала, что образование ионов Со³⁺ энергетически выгоднее возникновения анионов О¹⁻. Таким образом, в СоО в окта-позициях наряду с ионами Co²⁺ возникают и ионы Co³⁺. Тот факт, что нестехиометрический электронейтральный кристалл СоО характеризуется наличием катионных вакансий, подтверждается дырочной проводимостью исследуемых кристаллов и меньшим значением плотности по сравнению с теоретической плотностью [8]. Уменьшение плотности образцов твердого раствора $Li_x Co_{1-x} O$ с ростом xсвидетельствует о замещении в решетке тяжелых атомов Со более легкими атомами Li. Монотонное уменьшение параметра элементарной ячейки в твердом растворе Li_xCo_{1-x}O при увеличении концентрации добавки Li также свидетельствует в пользу того, что ионы Li (ионный радиус R_{1i^+} = 0.78 Å) замещают ионы Со (ионный радиус $R_{_{Co}^{2+}} = 0.82$ Å), так как $R_{_{Li}^+} < R_{_{Co}^{2+}}$. Это предположение подтверждает также следующий факт. Если считать, что образование твердого раствора $Li_xCo_{1-x}O$ происходит в соответствии с реакцией

$$\frac{x}{2}\operatorname{LiO} + (1-x)\operatorname{CoO} + \frac{x}{4}\operatorname{O}_2 \to \left(\operatorname{Co}_{1-2x}^{2+}\operatorname{Li}_x^{1+}, \operatorname{Co}_x^{3+}\right)\operatorname{O},$$

т.е. если ион Li замещает Co — основной катион раствора, то в этом случае электропроводность σ составов с разной концентрацией примесных атомов Li должна увеличиваться пропорционально содержанию Li. В эксперименте наблюдалось именно такое поведение σ от *x*.

Таким образом, рассмотренная выше совокупность экспериментальных фактов свидетельствует о том, что Li предпочтительно замещает основной катион Co в кристаллах CoO.

Из релаксационных процессов, обусловленных точечными дефектами в кристаллах, наиболее хорошо изучены релаксация Сноека, релаксация Зинера и релаксация пары "вакансия – примесь замещения" [9–11].

Релаксация Сноека [9, 11] обусловлена примесными атомами внедрения (обычно менее 0.1 ат. %), растворенными в ОЦК-решетке кристаллов и действующими как упругие диполи тетрагональной симметрии. Внедренный атом примеси совершает термически активируемые скачки в соседние положения, при этом ось диполя каждый раз переориентируется на 90° , что сопровождается механическими потерями. Высота релаксационного пика Q^{-1} изменяется линейно с концентрацией, а энергия активации пика Q^{-1} является энергией активации миграции примесных атомов внедрения. Поскольку исследуемый твердый раствор Li_xCo_{1-x}O представляет собой твердый раствор замещения, а не внедрения, то интерпретация закономерностей низкочастотного пика Q^{-1} в рамках механизма Сноека маловероятна.

В твердых растворах замещения может наблюдаться релаксация, связанная с изменением относительного расположения атомов в сплаве под действием внешних напряжений - так называемая релаксация Зинера [9, 10]. При низких концентрациях примеси высота релаксационного пика Q^{-1} , согласно этому механизму, пропорциональна квадрату концентрации растворенных атомов, а энергия активации представляет собой энергию активации диффузии примесных атомов. Релаксационный пик В внутреннего трения в низкотемпературной фазе кристалла СоО, легированного Li, по-видимому, не является зинеровским, поскольку, во-первых, высота пика Q_m^{-1} не пропорциональна квадрату концентрации легирующей добавки Li (рис. 26, кривая 2), а во-вторых, энергия активации пика В (равная 0.3 эВ) гораздо меньше энергии активации диффузии атомов Li в CoO, которая, согласно [8], составляет 1.2 эВ.

В ионных кристаллах при неизовалентном замещении ионов наблюдаются также релаксационные процессы, обусловленные образованием пар "вакансия — примесный атом замещения" [12, 13]. Благодаря кулоновскому взаимодействию иона примеси и вакансии в таких системах возникает упругий диполь, переориентация которого под действием внешних механических напряжений и является причиной внутреннего трения. Энергия активации такого процесса должна быть близка к энергии активации диффузии атомов в кристалле, поэтому такой механизм также не может быть ответствен за релаксационный пик *B* в CoO: Li, энергия активации которого заметно меньше.

Особенности поведения низкочастотного внутреннего трения в CoO с добавками Li можно объяснить на основе модели перескоков носителей заряда, рассмотренной в [14]. Суть механизма релаксации заключается в следующем. Если в решетку диэлектрика ввести иновалентный атом примеси, то это приведет к появлению дырки или электрона, которые затем могут быть захвачены примесью. Таким образом, в решетке кристалла создается электрический и упругий диполь, переориентация которого под действием внешних механических напряжений приводит к релаксации, связанной с перемещением дырки или электрона.

Известно, что чистый кристалл СоО является полупроводником *p*-типа со структурой типа NaCl, причем, согласно оценкам, образование катионов Co³⁺ энергетически выгоднее, чем возникновение анионов O¹⁻. Добавка иона Li¹⁺ приводит к появлению электрического диполя Li¹⁺ — Co³⁺. При достаточно низких температурах дырка связана с Li¹⁺ силами кулоновского взаимодействия. Она может перемещаться вокруг иона Li¹⁺ по ближайшим к нему ионам Co²⁺. При этом диполь Li¹⁺—Co³⁺ изменяет свою ориентацию, что



Рис. 4. Схема образования упругого диполя в кристалле CoO, легированном ионами Li.

вызывает определенные искажения решетки, так как ионы кислорода отталкиваются эффективным отрицательным зарядом иона Li¹⁺ в решетке СоО и притягиваются эффективным положительным зарядом иона Co³⁺ (рис. 4). Эффект усиливается тем, что ионный радиус Co³⁺ (0.82 Å) больше, чем у Li¹⁺ (0.78 Å). В результате вокруг иона Со³⁺ образуется уплотнение, а вокруг иона Li¹⁺ разрежение. Поэтому пара Li¹⁺-Co³⁺ является не только электрическим, но также и механическим диполем. Переориентация диполя может осуществляться как в переменном электрическом поле, так и под действием переменных механических напряжений в результате перескоков дырки по ионам Со³⁺, являющимися ближайшими соселями Li¹⁺. При этом максимум потерь должен наблюдаться при частоте измерительного поля, равной частоте перескока дырок.

Очевидно, образование упругого диполя $Me^{1+}-Co^{3+}$ возможно в тех случаях, когда Me^{1+} имеет более низкое значение электроотрицательности по сравнению с Co^{3+} и более высокую величину второго ионизационного потенциала по сравнению с третьим потенциалом ионизации Co^{3+} .

Если брать в качестве примесной добавки щелочные элементы, например, Li, Na или K, то, согласно написанному выше критерию, к образованию упругого дипольного центра в CoO (а следовательно, к релаксационному пику Q^{-1}) должны приводить добавки Li и Na. Это связано с тем, что электроотрицательность Co (равная 1.7) больше, чем у Li (1.0) или Na (0.5), а вторые потенциалы ионизации Li (75.62 эВ) и Na (47.30 эВ) превосходят 3-й потенциал ионизации Co (33.49 эВ). Электропроводность таких твердых растворов должна увеличиваться с ростом концентрации примесной добавки, так как каждый примесный атом приводит к образованию дырки. В отличие от добавок Li и Na примесные атомы K не должны

вызывать образование дипольной пары K^{1+} —Co³⁺ по следующим соображениям. Хотя электроотрицательность K (равная 0.8) близка по величине к электроотрицательности Li и Na, но 2-й потенциал ионизации атома K (31.70 эВ) меньше 3-го потенциала ионизации атома Co [15]. Следовательно, для обеспечения условия электронейтральности атом K должен быть дважды ионизирован, в этом случае диполь не образуется.

Таким образом, полученные результаты позволяют считать, что релаксационный процесс, ответственный за пик *B* в CoO: Li, обусловлен переориентацией упругих диполей $Co^{3+}-Li^{1+}$ под действием переменного внешнего напряжения. Предполагается при этом, что ион кислорода сохраняет свой двойной заряд из-за большого значения сродства к электрону, а ион лития – один положительный заряд из-за того, что имеет высокий второй ионизационный потенциал. В результате каждый акт замещения иона Co²⁺ на ион Li¹⁺ сопровождается образованием одного иона Со³⁺ и одной дырки. Тогда увеличение концентрации примеси Li в решетке CoO приводит к такому же увеличению числа ионов Со³⁺, дающих вклад в механическую релаксацию, и числа дырок, обусловливающих электрическую проводимость кристалла. По-видимому, элементарный механизм, ответственный за пик В и электропроводность, является общим, что согласуется с одинаковой зависимостью энергий активации релаксационного процесса и электропроводности от концентрации добавки лития.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 09-02-97500 р_центр_а).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Метфессель З., Маттис Д. Магнитные полупроводники. М.: Мир, 1972. 405 с.
- 2. *Fujita K., Mochida T., Nakamura K. //* Jpn. J. Appl. Phys. Part 1. 2001. V. 40. P. 4644.
- Funahashi R., Mihara T., Mikami M. et al. // Appl. Phys Lett. 2004. V. 85. P. 1036.
- 4. Гриднев С.А., Павлов В.С., Постников В.С., Турков С.К. // Аналитические возможности метода внутреннего трения. М.: Наука, 1973. 196 с.
- 5. Gridnev S.A. // Ferroelectrics. 1990. V. 112. P. 107.
- Gridnev S.A., Kosilov A.T. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2002. V. 35. P. 1538.
- 7. *Кристиан Д.* Фазовые превращения. М.: Мир, 1968. 272 с.
- Мень А.Н., Воробьев Ю.П., Чуфаров Г.И. Физикохимические свойства нестехиометрических окислов. Л.: Химия, 1973. 223 с.
- 9. Новик А., Бери Б. Релаксационные явления в кристаллах. М.: Атомиздат, 1975. 472 с.
- 10. *Golovin I.S., Jager S., Semin V.A. et al.* // Solid State Phenomena. 2008. V. 137. P. 69.
- Weller M., Wegst U.G.K. // Mater. Sci. Eng. A. 2009. V. 521–522. P. 39.
- 12. Wachman J.B. // Phys. Rev. 1963. V. 131. № 2. P. 517.
- 13. Dreyfus R.W. // Phys. Rev. 1961. V. 121. № 6. P. 1675.
- Гриднев С.А. Механизмы внутреннего трения в сегнетоэлектриках и сегнетоэластиках. дисс.... д-ра физ.-мат. наук. Л.: ЛПИ, 1983.
- Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. Кикоина И.К. М.: Атомиздат, 1976. 1008 с.